

Contents

Review Papers		
Metody povrchové a tenkovrstvové analýzy prvkového složení (XPS, AES, SIMS), difrakce fotoelektronů <i>Methods of surface and thin film analysis of chemical composition, photoelectron diffraction</i>	K. Mašek, P. Bábor	251
Papers		
Fázová transformace v austenitické oceli vyvolaná plastickou deformací <i>Phase transformation in austenitic steel induced by plastic deformation</i>	J. Drahokoupil, P. Haušild, V. Davydov a P. Pilvin	258
Vliv reálné struktury na kvantitativní fázovou analýzu <i>Influence of real structure on quantitative phase analysis</i>	J. Hamza, R. Čerstvý, J. Marek, F. Filuš, P. Mazal	263
Porovnání výsledků makrodifrakčních a mikrodifrakčních experimentů na forenzních vzorcích <i>Comparison of results of the microdiffraction and macrodiffraction of forensic samples measurements</i>	I. Jebavá, V. Goliáš, M. Kotrlý	266
Laboratories		
Aplikácia metód rtg. difrakcie na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach <i>Application of X-ray Diffraction Methods on the Department of Inorganic Chemistry, Institute of Chemical Sciences, Faculty of Science, P. J. Safarik University in Košice</i>	J. Černák	269
Other contributions, letters		
Dokonalá zrna karbidu křemíku připraveného metodou vysokoteplotní samošířící se syntézou (VSS) <i>Perfection of silicon carbide grains prepared with selfpropagating high temperature synthesis (SHS)</i>	L. Sodomka	271
Vzpomínka na Zdeňka Zikmunda	J. Hybler	274
Neoficiální zpráva o činnosti člena Výpočetní komise IUCr <i>Unofficial report on activities of a member of the IUCr commission on crystallographic computing</i>	K. Huml	275
Informace o vydaných knihách <i>Information on new books</i>	L. Sodomka	278
Krystalografická společnost v roce 2011 <i>Czech and Slovak Crystallographic Association in 2011</i>	J. Hašek, R. Kužel	279
FEBS Advanced Course	I. Kutá Smatanová	287
Obsah <i>Contents</i>		288
Author Index		289